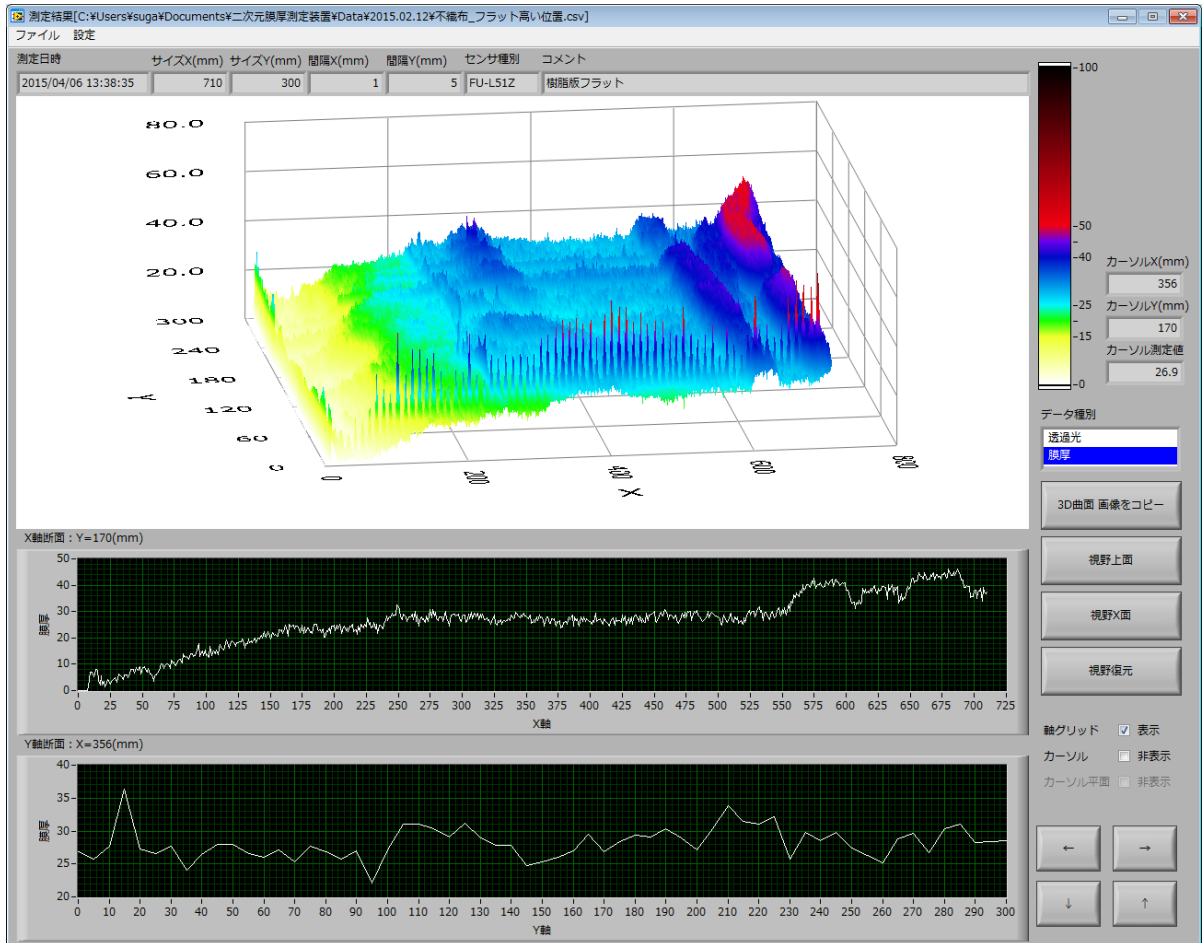


透過式膜厚測定装置

光の透過により、**ミクロンサイズ**で膜厚を測定します！



<操作画面イメージ図>

◆ 高速測定

センサヘッドを移動させながら測定

≪ 対象薄膜 ≫

- 主要な厚みが100 μ m以下
- 空隙率が50%以上
- 表面が平滑でない



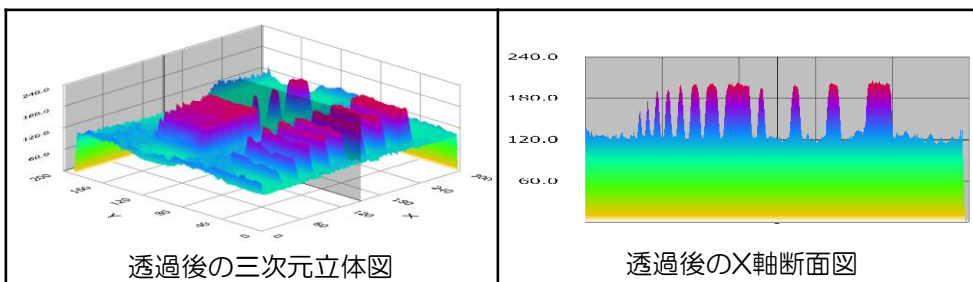
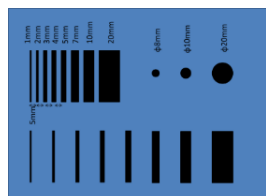
<装置本体>

仕様

■主な機能

1. XYステージの稼働範囲及び移動速度を設定
2. 膜厚換算設定機能
3. 膜表面測定結果の3D表示機能
4. 透過光測定機能
5. 測定結果ファイル保存機能

モデルシート



■システム構成例



■機器構成

分類	項目	内容
パソコン	O/S	Windows 7 Professional 32bit SP1
	ソフトウェア	二次元膜厚測定装置ソフトウェアVer1.00 Office Personal 2013SP1
XYステージ	筐体	九州計測器製(S/N: 141113) 1台
	外形寸法	1100x600x400mm (幅×奥行き×高さ)
	X軸アクチュエータ	IAI製 ストローク750mm 1台
	Y軸アクチュエータ	IAI製 ストローク300mm 2台
	ファイバセンサ	KEYENCE製FU-L50Z・FU-L51Z 各1台
	ファイバアンプ	KEYENCE製FS-N11MN 2台
制御盤	外形寸法	500x350x400mm (幅×奥行き×高さ) (突起部除く)
	測定部	九州計測器製

計測ソフトウェア及び、XYステージ形状は**カスタマイズ可能**です！

※本製品は、福岡県工業技術センター 化学 繊維研究所の指導をもとに開発されたものです。

お気軽にお問合せください

【製造】

QK QUALITY & KINDNESS
九州計測器株式会社

本社：〒812-0015 福岡市博多区山王1丁目6-18
TEL：092-441-3200
FAX：092-441-3264
Web：http://www.qk-net.co.jp

【販売】

株式会社メック

本社：〒838-0137 福岡県小郡市福童196-1
TEL：0942-72-7266
Web：http://www.mecc.co.jp/